

电子线路连接性测试断路原因模型分析

产品名称	电子线路连接性测试断路原因模型分析
公司名称	深圳市华瑞测科技有限公司
价格	16.00/件
规格参数	厂家:华瑞测 型号:WET16 周期:3-7天
公司地址	中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号
联系电话	0755-23093158 13684912512

产品详情

电子元器件技术的快速发展和可靠性的提高奠定了现代电子装备的基础，元器件可靠性工作的根本任务是提高元器件的可靠性。

失效模式
开路，短路，漏电，功能失效，电参数漂移，非稳定失效等。
常用手段
电测：连接性测试、电参数测试、功能测试等。
制样技术：开封技术(机械开封、化学开封、激光开封)、去钝化层技术(化学腐蚀去钝化层、等离子腐蚀去钝化层、机械研磨去钝化层)、微区分析技术(FIB、CP)等。

显微形貌分析：光学显微分析技术、扫描电子显微镜二次电子像技术等。
表面元素分析：扫描电镜及能谱分析(SEM/EDS)、俄歇电子能谱分析(AES)、X射线光电子能谱分析(XPS)、二次离子质谱分析(SIMS)等。
无损分析技术：X射线透视技术、三维透视技术、反射式扫描声学显微技术(C-SAM)等。
服务流程 · **项目沟通**：深入了解客户需求，设计zuijia检测方案